## 05;12

## Влияние нейтронного облучения на ИК спектры поглощения монокристаллов оксида меди

© Н.Н. Лошкарева, Б.А. Гижевский, Ю.П. Сухоруков, А.Е. Карькин, С.В. Наумов

Институт физики металлов УрО РАН, 620219 Екатеринбург, Россия

## (Поступило в Редакцию 19 октября 1998 г.)

В спектрах монокристаллов CaO, облученных нейтронами с флюенсом  $5 \cdot 10^{18}$  cm<sup>-2</sup>, наблюдается сильный рост коэффициента поглощения при увеличении энергии фотонов от 0.1 до 1.0 eV. Разность коэффициентов поглощения до и после облучения зависит от длины волны как  $\lambda^{-2}$ . Результаты воздействия нейтронного облучения на CuO качественно подобны воздействию нейтронов на другие полупроводники (например, GaAs) и отличаются от результатов облучения CuO заряженными частицами.

Инфракрасные оптические спектры CuO, так же как и спектры полупроводниковых составов медь-кислородных высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП), свидетельствуют о фазовой неоднородности этих материалов и могут быть описаны на основе кластерного подхода существованием в основной матрице, состоящей из кластеров (CuO<sub>4</sub>)<sup>6-</sup>, зародышей фазы полярных ян-теллеровских центров (дырочных (CuO<sub>4</sub>)<sup>5-</sup> и электронных (CuO<sub>4</sub>)<sup>7-</sup>) [1]. Как было показано нами, облучение CuO высокоэнергетическими заряженными частицами — электронами и ионами He<sup>+</sup> [2,3] приводит к существенным изменениям структуры и анизотропии спектров оптического поглощения, которые обусловлены спецификой CuO как фазово-неоднородного соединения [1].

В настоящей работе исследуется влияние облучения нейтральными частицами — нейтронами с флюенсом  $5 \cdot 10^{18}$  сm<sup>-2</sup> на спектры инфракрасного поглощения монокристаллов CuO, вырезанных вдоль плоскости (110) и вдоль плоскости (*ac*). Температура при облучении была менее 100°С. Из рентгеновских дифрактограмм следует, что параметры моноклинной решетки не изменились, линии уширились. Электросопротивление образцов до отжига составляло  $10^2 \Omega \cdot m$ , после облучения увеличилось на 2–3 порядка. При этом не было замечено изменения анизотропии электросопротивления после облучения.

Спектры поглощения монокристаллов CuO исследовались в диапазоне энергии фотонов 0.1-1.0 eV (в области между краем фундаментального поглощения  $E_g = 1.46 \text{ eV}$  и фононным спектром). Качество оптических поверхностей после облучения не ухудшилось.

В исследованном диапазоне имеются полоса поглощения при 0.2 eV (рис. 1), соответствующая переходам в дырочном ян-теллеровском центре [1], и область слабо возрастающего к высоким энергиям поглощения. После облучения обнаружен сильный монотонный рост поглощения начиная с 0.1 eV. Такое изменение спектров наблюдается как при падении света на плоскость (*ac*), так и в случае плоскости (110), для естественного и поляризованного света. Заметного увеличения интенсивности полосы при 0.2 eV на фоне бесструктурного роста поглощения не произошло. В моноклинном кристалле СиО в плоскости (ac) лежит ось [101], относительно которой мы наблюдали сильную анизотропию коэффициента поглощения вблизи перехода при 0.2 eV [1]. Естественный дихроизм — отношение разности коэффициентов поглощения для поляризаций параллельной и перпендикулярной оси [101] к их сумме в необлученном кристалле составляет более 40%. При облучении CuO заряженными частицами (электронами и ионами He<sup>+</sup>) лихроизм в области полосы при 0.2 eV менялся существенно (в 2 раза). При облучении нейтронами существенного изменения дихроизма не наблюдается, что свидетельствует о неизменности анизотропии дырочных центров. В отличие от облучения ионами Не<sup>+</sup> и электронами при облучении нейтронами в спектрах не появилось новых полос.

Разность коэффициентов поглощения до и после облучения  $\Delta K$  с хорошей точностью (2%) обратно пропорциональна квадрату длины волны (рис. 2) как для образца вырезанного в плоскости (110) при измерениях в естественном свете, так и для образца, вырезанного в плоскости (*ac*), при измерениях в линейно поляризован-



**Рис. 1.** Спектры поглощения монокристалла CuO, плоскость *ac*, в поляризованном свете до облучения (*1*, *2*) и после (*3*, *4*): *1*, *3* —  $E \perp [\overline{101}]$ ; *2*, *4* —  $E \parallel [\overline{101}]$ .



**Рис. 2.** Зависимость разности коэффициентов поглощения СиО до и после облучения от длины волны: 1 — плоскость (110), естественный свет; 2 и 3 — плоскость ac, поляризованный свет,  $E \perp [\overline{1}01]$  и  $E \parallel [\overline{1}01]$ .

ном свете с направлением вектора Е вдоль и перпендикулярно оси [101]. Дополнительное поглощение является результатом рассеяния света на созданных облучением дефектах. Зависимость  $\Delta K \sim \lambda^{-2}$  наблюдалась в обычных полупроводниках, например в GaAs, и связывалась с "металлоподобными" включениями [4]. Нейтроны являются наиболее повреждающими частицами. Первично выбитый атом с энергией существенно выше пороговой быстро теряет эту энергию при соударениях с другими атомами. Результатом такого взаимодействия являются термические клинья и области разупорядочения. Высокая температура в области термического клина может вызвать локальную диссоциацию и выпадение компонент в виде коллоидных включений. Такими включениями в матрице CuO могут быть зародыши неоднородной фазы, которые в результате нейтронного воздействия образуют мелкодисперсную структуру (размером меньше 0.01-0.1 µm), с преобладающим в зародышах числом электронных ян-теллеровских центров, оптические переходы в которых запрещены. Возможно возникновение электронных центров является одной из причин увеличения сопротивления вследствие компенсации акцепторов в исходном оксиде меди р-типа. Другой причиной увеличения электросопротивления, по-видимому, являются эффекты разупорядочения решетки, приводящие к флуктуациям потенциала. Рентгеновские дифракционные данные подтверждают возникновение разупорядочения после облучения.

Таким образом, облучение CuO нейтронами приводит к радиационно-стимулированному бесструктурному поглощению, характерному для бинарных полупроводников (например, GaAs). Результаты нейтронного облучения существенно отличаются от случая облучения CuO заряженными частицами, при котором ярко проявляется специфика фазовонеоднородного состояния оксида меди. Авторы благодарят сотрудника Свердловского филиала научно-исследовательского и конструкторского института электротехники С.М. Вовка за содействие в измерениях.

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 96-02-16063.

## Список литературы

- Москвин А.С., Лошкарева Н.Н., Сухоруков Ю.П. и др. // ЖЭТФ. 1994. Т. 105. Вып. 4. С. 967–993.
- [2] Сухоруков Ю.П., Лошкарева Н.Н., Москвин А.С. и др. // ФТТ. 1997. Т. 39. Вып. 12. С. 2141–2146.
- [3] Гижевский Б.А., Белых Т.А., Наумов С.В. и др. // ФХОМ. 1998. № 1. С. 9–14.
- [4] Коноплева Р.Ф., Литвинов В.Л., Ухин Н.А. Особенности радиационного повреждения полупроводников частицами высоких энергий. М.: Атомиздат, 1971. 176 с.